

Nominal Frequency 标称频率: 25.000MHz

Mode of Oscillation 振动模式: AT Fundamental

Frequency Tolerance at 25°C 调整频差: $\pm 20\text{ppm}$

Temperature Frequency Stability 温度频差: $\pm 30\text{ppm}$

Operating Temperature Range 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}-- +70^{\circ}\text{C}$

Storage Temperature 贮存温度: $-40^{\circ}\text{C}-- +85^{\circ}\text{C}$

Equivalency Resistance 等效电阻: $\leq 40\ \Omega$

Load Capacitance 负载电容: 20PF

Drive Level 激励功率: 1.0uW Max

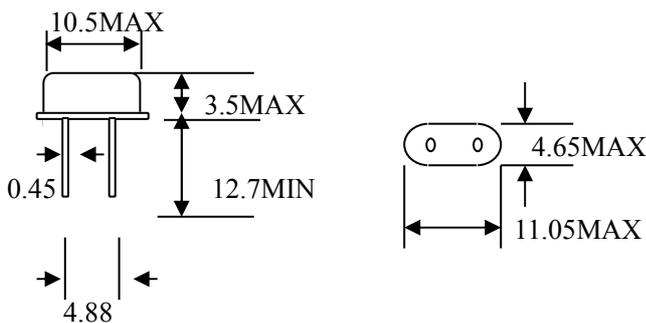
Shunt Capacitance 静电容: $\leq 7.0\text{pF}$

Insulation Resistance 绝缘阻抗: $> 500\text{M}\ \Omega$ at DC 100V

Aging 老化: $\pm 3\text{ppm/year}$

Hold Type 盒型: 49/US

Marking 标志:



单位: mm

25.000

2.1 跌落:
方 法: 高度 100 厘米,跌落 3 次于 3 厘米硬木地面,室温静置 1~2 小时后测试 测试设备: S&A 250B
测试标准:频率变化量: +/-3ppm; Rr 满足规格要求
2.2 振动
方 法: 振动频率 10~55Hz, 振幅 1.5mm, X/Y/Z 方向各 30 分钟, 室温静置 1~2 小时后测试
测试标准: 频率变化量: +/-5ppm; Rr 满足规格要求
2.3 泄漏:
方 法:将晶体置于酒精罐中, 加压 0.4~0.5Mpa, 保持 10 分钟。 取出后用风吹 5 分钟
测试设备: 绝缘测试仪,测试标准: IR ≥ 500 M Ω (100V +/- 15V D.C)
2.4 弯曲
方 法: 5N, 90° , 3 次; 测试设备: 试验装置,测试标准: 无裂痕。
2.5 可焊性
方 法: 235 ± 5°C、3 秒,测试设备: 试验装置,测试标准: 90% 浸锡良好。
2.6 恒温恒湿:
方 法: 温度 40°C +/- 2°C, 相对湿度 90-95%, 250 小时.测试设备: KH-1240&250B 测试标准: 频率变化量: +/-5ppm Rr 满足规格要求

2.7 低温储存

方法：温度 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，储存 250 小时，室温静置 1~2 小时后测试,测试设备: KH-1240&250B

测试标准：频率变化量: $\pm 5\text{ppm}$; Rr 满足规格要求

2.8 高温储存

方法：温度 $+85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，储存 250 小时，室温静置 1~2 小时后测试

,测试设备: KH-1240&250B 测试标准：频率变化量: $\pm 5\text{ppm}$; Rr 满足规格要求。